

**Plan zajęć – kier.: FT; Zaawansowane Laboratoria Specjalistyczne
- 2 grupy, II stopień, sem. 1 (letni), rok akad. 2022/2023**

Tydzień		Ćw. I	Ćw. II	Ćw. III	Ćw. IV	
1.	27 II	Zajęcia organizacyjne pok. 601, bud. A1, 9:45-11:15				
2.	6 III	1(IA), 2 (IA)	1, 2			
3.	13 III					
4.	20 III	2(IB) <small>13:30-19:05</small>			1	
5.	27 III	2(IB) <small>13:30-19:05</small>			1	
6.	3 IV	1(IB) <small>13:30-19:05</small>			2	
7.	17 IV	1(IB) <small>13:30-19:05</small>			2	
8.	24 IV	2(IC) <small>9:45-15:45</small>			1	
9.	8 V	2(IC) <small>9:45-15:45</small>			1	
10.	15 V	1(IC) <small>9:45-15:45</small>			2	
11.	22 V	1(IC) <small>9:45-15:45</small>		2		
12.	29 V					1,2
13.	5 VI					1,2
14.	12 VI	Uzupełnienia + konsultacje – 8:00 – 15:00 (w zależności od prowadzącego zajęcia)				
15.	19 VI	Zaliczenia, sala 225, bud. A1, godz. 9:45 – 10:45 Prodziekan ds. kształcenia				

Pracownik prowadzący ćwiczenie	Temat ćwiczenia
<p>dr Maciej Kamiński</p> <p>dr inż. Marek Nowicki</p> <p>dr inż. Marek Weiss</p> <p>dr hab. Arkadiusz Ptak, prof. PP</p> <p>doc. dr Gustaw Szawiola, dr inż. Przemysław Głowacki</p> <p>dr Ewa Chrzumnicka</p>	<p>I. Metody charakteryzacji właściwości fizycznych powierzchni i nanostruktur (Nano-charakteryzacja) Hala 22, sala F2</p> <p>IA – Skaningowa mikroskopia i spektroskopia tunelowa.</p> <p>IB – Charakteryzacja właściwości elektrycznych i magnetycznych powierzchni za pomocą AFM.</p> <p>IC – Charakteryzacja właściwości nano-tribologicznych za pomocą AFM</p> <p>II. Modelowanie molekularne (s. 602)</p> <p>III. Narzędzia i metody spektroskopii swobodnych atomów i jonów</p> <p>IV. Metody badania materiałów funkcjonalnych dla optoelektroniki</p>